PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-053504

(43) Date of publication of application: 19.02.2002

(51)Int.Cl.

CO7C 31/28 CO7F 7/28 CO7F 19/00 C23C 16/40 H01L 21/316

(21)Application number: 2000-280950

(71)Applicant: KOJUNDO CHEM LAB CO LTD

(22)Date of filing:

11.08.2000

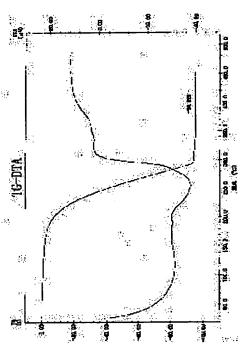
(72)Inventor: KADOKURA HIDEKIMI

(54) TANTALUM TITANIUM DOUBLE ETHOXIDE, METHOD FOR PRODUCING THE SAME AND METHOD FOR PRODUCING OXIDE FILM USING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a one-package metal alkoxide raw material compound or composition for forming a TiO2-containing Ta2O5 film having excellent insulation properties by a CVD method and to provide both a method for producing the compound and a method for forming a film using the compound.

SOLUTION: Tantalum titanium double ethoxide TaTi(OEt)9 being a new compound or Ta(OEt)5 containing TaTi(OEt)9 is a one-package body at room temperature and its vaporization characteristics and thermal decomposition characteristics behave like one component. Ta(OEt)5 is mixed with Ti(OEt)4, heated, then distilled under reduced pressure to produce particle-free TaTi(OEt)9 or Ta(OEt)5 containing TaTi(OEt)9, which is supplied to a liquid mass flow controller, vaporized and subjected to CVD in an oxygen-containing atmosphere at 600° C to form an amorphous TiO2-containing Ta2O5 film in excellent reproductivity of composition.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

25.04.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-53504 (P2002-53504A)

(43)公開日 平成14年2月19日(2002.2.19)

東京都豊島区千川1丁目25番7号203室

(51) Int.Cl.'		賦別記号	FI	7-71-1 (多考)
C07C	31/28		C 0 7 C 31/28	4H006
C07F	7/28		C07F 7/28	B 4H049
	19/00		19/00	4H050
C 2 3 C	16/40		C 2 3 C 16/40	4 K 0 3 0
H01L	21/316		H01L 21/316	X 5F058
			水嶺 水嶺朱 水葡杏香	項の数5 書面 (全11頁)
(21)出願番		特願2000-280950(P2000-280950)	(71)出顧人 000143411	
(22)出顧日		平成12年8月11日(2000.8.11)	埼玉県坂戸市	度化学研究所 千代田 5 丁目 1 番28号
			(72)発明者 門倉 秀公	

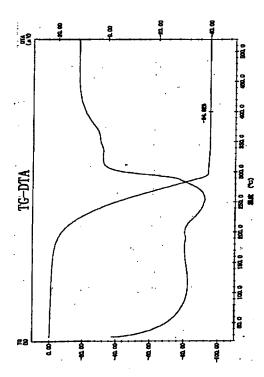
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 タンタルチタンダブルエトキシドとその製法およびそれを用いた酸化物膜の製法

(57)【要約】

【課題】絶縁性のよい TiO_2 含有 Ta_2O_5 膜をCV D法で形成するための1 液の金属アルコキシド原料化合物および組成物を提供する。さらにその製法およびそれを用いた成膜方法を提供する。

【解決手段】新規化合物であるタンタルチタンダブルエトキシドTaTi(OEt)。あるいはTaTi(OEt)。な、室温で一液体であり、その気化特性や熱分解特性は、一成分のようにふるまう。Ta(OEt)。とTi(OEt)。を混合加熱後、減圧蒸留することにより、パーティクルのないTaTi(OEt)。あるいはTaTi(OEt)。を含有するTa(OEt)。を製造する。これを液体マスフローコントローラーで供給し、気化させ、酸素を含んだ雰囲気、600℃でCVDすることにより、アモルファス状のTiOz含有TazO。膜を組成の再現性よく形成できる。



【特許請求の範囲】

【請求項 1 】 T a T i (O C 2 H 5) 9 で表されるタンタルチタンダブルエトキシド。

【請求項2】請求項1の化合物を含有するタンタルエトキシド。

【請求項3】タンタルエトキシドとチタンエトキシドと を混合加熱し、ついで蒸留することを特徴とする請求項 1 および請求項2記載の化合物の製法。

【請求項4】請求項1および請求項2記載の化合物を用いることを特徴とするCVD法による酸化チタン含有酸 10化タンタル膜の製法。

【請求項5】請求項1および請求項2記載の化合物を液体マスフロー装置で供給することを特徴とするCVD法による酸化チタン含有酸化タンタル膜の製法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、LSIのコンデンサーなどの誘電体膜を、化学気相成長法(CVD法)にて形成するための原料として好適な金属アルコキシド化合物とその製法およびそれを用いた酸化物薄膜の製法に 20関する。

[0002]

【従来の技術】LSIの高集積化に伴い、DRAMのキ ャパシタとしてCVD法による酸化タンタル(Ta2O 5) 膜が実用化しつつある。その絶縁性を向上するため のひとつの方法として、特公平6-27328号、US 4734340号は、Ta2 O5 にTiO2をTi/T a=0. $1\sim4$ a t %となるようにドーピングすること を開示している。低リーク電流特性を有する絶縁強度の 高い膜を作るには、組成を最適に制御することが重要で ある。その原料供給の方法は、第一のバブラーにタンタ ルエトキシド (Ta (OEt)s)を入れ、第二のバブ ラーにチタンイソプロポキシド(Ti(OiPr),) を入れ、各々を適当な温度に加熱し、キャリヤーガスで バブリングし、それぞれの蒸気をCVD室に供給する方 法である。最近では、液体マスフローで制御する方法も ある。しかし、2ソースからの供給では、量と比率の正 確な制御が容易ではない。さらにTa(OEt)5とT i(OiPr)、とは液相または気相で混合されると、 アルコキシ基の交換反応が起き、より複雑な化合物に一 40 部変化し、その蒸気圧やCVD特性がもとの原料と違っ てしまい、膜組成の制御が難しくなるという問題があ る。よって、あらかじめTa(OEt)5とTi(Oi Pr) 4 を混ぜた一液をソースとすることはできなかっ た。このことは、本発明の比較例でも明らかにされてい

【0003】2000年6月21日に見た英国Inor gtech社のインターネットホームページ(htt p://www.inorgtech.co.uk)オ ンラインニュースは、J-P Senateurらが1 50

ソースのTa(OEt) 4 (dmae) / Ti(OE t) 2 (d m a e) 2 ヘキサン溶液を用いて、液体イン ジェクション供給のCVDでTa2O5/TiO2膜を 作ったことを開示している。この原料を250℃の気化 器で気化させ、500℃で成膜した結果、膜はアモルフ ァスであり、そのTa/Ti比はソース液のTa/Tiに非常に近かったとのことである。ここでdmaeは、 dimethylaminoethoxideジメチル アミノエトキシドである。彼らは、Ta(OEt) 4 (dmae) は単量体なので、二量体のTa(OE t)。より蒸気圧が高く、気化しやすいこと、Ta(O Et) 4 (dmae) / Ti (OEt) 2 (dmae) 2 は有害なアルコキシ基の交換反応を最小にできるとし ている。しかし、Ta(OEt)₄(dmae)やTi (OEt) 2 (dmae) 2は、Ta(OEt) 5やT i (OEt) 4 から特別に製造しなければならないとい

2

[0004]

う量産時の問題がある。

【発明が解決しようとする課題】 TiO_2 含有 Ta_2O_5 膜を CVD法で形成するための 1 ソースの液体化合物ないし組成物を提供することである。室温において液体で、液体マスフローコントローラーにより制御でき、アルコキシ基の交換反応をおこすことなく、 Ta/TiO_5 気化特性や Ta/TiOCVD 特性が似ている化合物を提供する。さらにその化合物ないし組成物の製法およびそれを用いた TiO_2 含有 Ta_2O_5 膜の製法を提供することである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、TiOz含有 Ta2Os 膜をCVD法で成膜するために好適な1ソー スの液体材料であるTaTi(OCzHs)。(以下T a Ti (OEt)。と表す)で表されるタンタルチタン ダブルエトキシドである。さらに本発明は、TaTi (OEt)。を含有するTa(OEt)。である。本発 明は、Ti(OEt),とTa(OEt)。とを混合加 熱し、ついで蒸留することを特徴とするTaTi(OE t)。の製法である。また本発明は、Ti(OEt)。 と当モル以上のTa(OEt)。とを混合加熱し、つい で蒸留することを特徴とするTaTi(OEt)。を含 有する Ta (OEt) s の製法である。本発明は、Ta Ti(OEt)。あるいはTaTi(OEt)。を含有 するTa(OEt)₅を用いることを特徴とするCVD 法によるTiOz含有TazOs膜の製法である。本発 明は、TaTi(OEt)。あるいはTaTi(OE t)。を含有するTa(OEt)。を液体マスフロー装 置で供給することを特徴とするCVD法による酸化チタ ン含有酸化タンタル膜の製法である。

【0006】アルコキシ基の交換反応を防ぐにはTiと Taが同一のアルコキシ基を持つことが必要である。 Ta_2O_5 膜形成の原料として、通常はTa(OEt)5

が使われている。それと同じアルコキシ基をもつTi (OEt) 4 は熱履歴により会合度や融点が影響を受ける。その融点、蒸気圧、液、固体、気体の会合度をTa (OEt) 5とあわせて、表1に示した。表中*会合度 はD. C. Bradley, R. C. Mehrotra and D. P. Gaur "Metal Alkoxi* * des" P63-68 (1978Academic Press) による。その他の値は本発明者の測定値である。

【0007】 【表1】

化合物 mp(℃) ℃/0.1T ℃/1T ℃/10T 固、液体の会合度 気体の会合度 Ta(ORt), 21 118 155 200 2 2 Ti(ORt), 100~50 86 115 149 3~2.4* 1

T=Torr

【0008】 Ti(OEt)。の気体の会合度は、図2からもわかるように単量体である。EI-MS分析で、二量体から生成するはずのフラグメント Ti2(OEt)。 * などが検出されていないからである。これに対し Ta(OEt)。の気体は二量体である。すなわち、図1で、Ta2(OEt)。 * や Ta2(OEt)。 * が検出されている。

【0009】今までに、チタンアルコキシドと他の金属 20 アルコキシドとの複合アルコキシドの報告例は、アルカリ金属を除けば、ほとんどなかった。溶液中では生成していると推定される例はあったが、蒸留や昇華でそのものを単離できたことはなかった。本発明者は、Ta(OEt)。-Ti(OEt)。系を詳細に検討した結果、タンタルチタンダブルアルコキシドTaTi(OEt)。が生成していることを見出し、この化合物をCVDの原料として使うとTiO2含有のTa2O5膜が容易に製造できることを見出した。

[0010]

【発明の実施の形態】 (1) ダブルエトキシドの合成と 蒸留回収

実施例1で得られた各留分の組成は表2のとおりであ ※

※る。この結果、第2留分の組成はTaTi(OEt)。 の組成に近い。蒸留のデータから得たTaTi(OEt)。 の蒸気圧は $126\sim129$ \mathbb{C}/O . $4\sim0$. 5T or rであった。

[0011]

【表2】

	留分	留出温度(℃)	組成
	第1留分	110~126	Taa.aoTi20(OEt)s.2
ı	第2留分	126~129	Tas.soTise(OEt)s.s
ı	第3留分	129~140	Tar. 20 Tio. 20 (ORt) 9.6
	,		

【0012】(2)融点測定

各留分の融点を目視で測定した結果を表3に示す。いずれも0 \mathbb{C} 以上では、Ta (OEt) \mathfrak{g} と同程度の粘性の液体であった。すなわちTaTi (OEt) \mathfrak{g} に相当する組成物付近では0 \mathbb{C} 以上で液体であることがわかった。CVD原料として好ましい性質である。

[0013]

【表3】

留分	融点(℃)	20℃での粘性	-70℃での粘性
第1留分	<-70	Ta(OEt)。と同じ	僅かに動く程度で非常に高粘度
第2留分	<-70	Ta(OBt)。と同じ	かなり高粘度
第3留分	<-70	Ta(OEt)』と同じ	蝉蜜状で、第2留分より低粘度

[0014] (3) EI-MS

TaTi(OEt)。のダブルアルコキシドが生成していることを確認するために第2留分とTa(OEt)。とTi(OEt)。のEI-MS分析を行った。

測定条件

測定装置: JEOL AX505W

イオン化法: E I イオン源温度: 230℃

イオン化エネルギー: 70 e V

測定結果は、Ta(OEt)。のを図1に、Ti(OE 在する。このことは、他の分析手段の結果解析を加味しt)。のを図2に、第2留分のを図3に示した。主なm50 たいくつかの文献でTa(OEt)。は二量体であると

✓zと強度(%)とそのイオン種を以下に列挙した。
 【0015】のTa(OEt)s (図1)
 二量体の分子イオンTa2(OEt)10 (m/z=812)はなかった。
 m/z=767(28%)Ta2(OEt)s⁺722(21%)Ta2(OEt)s⁺693(25%)Ta2O(OEt)7 361(100%)Ta(OEt)
→
+
この結果からTa(OEt)sは気体で二量体として存在する。このことは、他の分析手段の結果解析を加味し

いう結論と一致する。 $Ta(OEt)_4$ は二量体からのフラグメントである。

【0016】**②**Ti(OEt)。(図2) 単量体の分子イオンTi(OEt)。[†] (228) や二 量体の分子イオンTi₂ (OEt)。[†] (456) はな かった。

m/z=227(4%) Ti(OEt) 3(OCH₂CH₂) + 213(100%) Ti(OEt) 3(OCH₂CH₂) + 183(77%) Ti(OEt) 3 + 169(26%) Ti(OEt) 2(OCH₃) + 20年間 (OEt) 2(OCH₃) + 20年間 (OCH₃) + 20年間 (OEt) 2(OCH₃) + 20年間 (OEt) 2(OCH₃) + 20年間 (OCH₃) + 20日間 (OC

この結果から T_i (OE_t)、は気体で単量体として存在する。このことは文献と一致する。

【0017】3第2留分 (図3)

ダブルアルコキシドの分子イオンTaTi(OEt)。 $^{\dagger}(634)$ はなかった。

m/z=757 (5%) Ta₂ (OEt)₉ + 589 (8%) TaTi (OEt)₈ + 544 (35%) Ta Ti (OEt)₇ + 515 (12%) TaTiO (OE t)₆ + 361 (100%) Ta (OEt)₄ + 213 (78%) Ti (OEt)₃ (OCH₂) + 183 (6 20 3%) Ti (OEt)₃

この結果、Taz (OEt) 10 のフラグメントである Ta₂ (OEt) o tに比べて、TaTi (OEt) o のフラグメントであるTaTi(OEt)s ⁺、TaT i(OEt), [†]、TaTiO(OEt)。 [†] の強度が かなり大きいことから、第2留分のTa(OEt) sは、多くはTaTi(OEt)。で存在している。こ のことは、会合相手のTi(OEt) 4 も多くはTaT i(OEt)。で存在していることを意味している。す なわち第2留分の気体は、多量のTaTi(OEt)。 と少量のTaz (OEt) 10 と少量のTi (OEt) ₄との混合物である。またTa(OEt)₄[†]、Ti (OEt) 3 (OCH2) [†]、Ti(OEt) 3 [†]は、 主にTaTi(OEt)。のフラグメントである。よっ て、この留分は、TaTi(OEt)。なるダブルアル コキシドの性質を多く発現すると考えられる。

【0018】(4) TG-DTA 第2留分のTG-DTA測定した。

測定条件

試料重量:50.0mg

雰囲気:ArI気圧

昇温速度:10.0deg/min

結果を図4に示した。ほぼ1成分として気化していることがわかる。

【0019】以上記したように、TaTi(OEt)。に相当する組成物は、主にダブルエトキシドTaTi(OEt)。であり、液体マスフローコントローラーで室温供給ができる粘性の液体であり、完全に蒸発するという、CVD原料として非常に好ましい物性を持つことがわかる。

【0020】本発明のダブルエトキシドTaTi(OE t)。の製法は、Ta (OE t)。と下i(OE t)。とを混合溶解し、加熱処理後、蒸留することである。5 $0\sim200$ ℃で $1\sim10$ 時間加熱処理を行うことにより、ダブルアルコキシドの形成が起きる。この際、母アルコールであるエタノール溶媒中で行ってもよい。根合溶解加熱処理しただけの液には、多数の微粒子(パーティクル)がある。これはTa (OE t)。やTi (OE t)。の秤量混合工程で、微量の大気が混入し、その湿気によりTa (OE t)。やTi (OE t)。が僅かに加水分解して生成した水酸化物である。そこで蒸留することにより、微粒子をなくせる。蒸留前の液体に赤色レーザーポインターで光線をあてると、多くの微粒子が認められたが、蒸留後の留出物には、全く微粒子は認められなかった。

6

【0021】本発明のダブルエトキシドTaTi(OEt)。を含有するTa(OEt)。の製法は、ダブルエトキシドTaTi(OEt)。の製法と同様である。すなわち目標の液組成と同じ割合でTa(OEt)。とTi(OEt)4、とを混合溶解し、加熱処理後、蒸留することである。Ti(OEt)4、がモル比 $O\sim1/2$ では、Ta(OEt)5、が過剰であり、少量側のTi(OEt)4 はほとんどがダブルエトキシドTaTi(OEt)5 を形成しているはずで、残りはTa2(OEt)6 である。

【0022】本発明の、TaTi(OEt)。あるいは TaTi(OEt)。を含有するTa(OEt)。をC V D 装置に供給する方法は、液体マスフローコントローラーで行うのが最も簡単で精確な制御ができる。この方法は純Ta2O。膜形成用に純Ta(OEt)。の供給に量産で用いられているので、実施は容易である。バブリング方式に比べ、量産ではるかに有利である。

【0023】本発明の、TaTi(OEt)。あるいはTaTi(OEt)。を含有するTa(OEt)。を用いたCVDは、減圧下400~700℃の酸化雰囲気中で行われ、TiOz含有TazOs膜が生成する。酸化剤として、酸素、オゾンなどが用いられる。CVDは、通常の熱CVDの他、プラズマCVD、オゾンCVD、光CVDなどが使える。

【0024】膜のTi/(Ti+Ta)原子割合は、 $0.01\sim0.2$ 程度のことが多い。このためには本発明のTaTi(OEt)。を含有するTa(OEt)。を用いるが、そのCVDでは液組成と膜組成がほぼ同じになるので、組成の制御は容易である。成膜温度、圧力によって組成が若干ずれた場合には、液組成にフィードバックすることにより、調節すればよい。

[0025]

【実施例 1 】 タンタルチタンダブルエトキシドTaTi (OEt)。 の製造

50 リフラックスコンデンサー、温度計、攪拌子を備えた1

00m1 三つロフラスコを真空置換しアルゴン雰囲気とし、 $Ta(OEt)_s 24.9g(61.3mmol)$ を仕込み、次いで塊状の $Ti(OEt)_4 13.7g(60.1mmol)$ を仕込んだ。仕込みTa/Tiをル比は0.505/0.495であった。次いで昇温すると、70 で付近で透明な均一液になり、攪拌しつつ100 で2時間加熱後、コンデンサーを枝付き分留頭に代え、蒸留圧力 $0.5\sim0.4$ Torr で蒸留した。留出温度 $110\sim140$ で、3 留分に分けて回収した。*

7

* 各留分は無色透明で、全量が留出した。各留分に赤色レーザーポインターをあてた目視観察では、パーティクルはなかった。各留分のTa、Tiを分析しその組成を求めた結果を表4に示す。なお第2留分の不純物元素分析の結果、Ta、Ti以外はすべて1ppm以下であった。

8

【0026】 【表4】

留分	留出温度(℃)	Ta(wt%)	Ti(wt%)	組成*
第1留分(11.1g)	110~126	23.4	9.31	Ta Ti 1.20 (OEt) 1
第2留分(9.1g)	12 6~129	25.8	8.36	Tan. soTi 10 (ORt),.2
第3留分(17.7g)	129~140	31.4	5.55	Tal.mTiam(OEt)s.s

TaTi(OBt):の理論値:Ta28.52%,Ti7.55%

【0027】組成^{*} はTa、Tiの分析値から計算した。(Ta+Ti)の当量が(OEt)の当量と完全には一致しない理由は、分析精度がやや悪いためと思われ 20 る。この結果、第2留分の組成はTaTi(OEt)。の組成に近い。主に第2留分を分析解析した結果は前述した。

[0028]

【比較例1】リフラックスコンデンサー、温度計、攪拌子を備えた100ml三つロフラスコを真空置換しアルゴン雰囲気とし、Ta(OEt)s20.3g(50.0mmol)を仕込み、次いでTi(OiPr)41 ※

[0029]

留分 組成**

第1留分 Ta_{0.48} Ti_{1.52} 第2留分 Ta_{1.66} Ti_{0.34}

【0030】液と固体 * は、約半分は留出中に固化し、融点 $50\sim100$ ℃の白色固体となった。組成 ** は、Ta、Ti、i Pr OH/Et OH0分析値から計算した。(Ta+Ti)の当量が(Oi Pr+OEt)の当量と完全には一致しない理由は、分析精度がやや悪いた 40 めと思われる。

【0031】0.6 Torrでの純Ti(OiPr)4の留出温度は約60 $^{\circ}$ 、純Ta(OEt) $_{\circ}$ の留出温度は約60 $^{\circ}$ 、純Ta(OEt) $_{\circ}$ の留出温度は約145 $^{\circ}$ である。第1留分は純Ti(OiPr) $_{\circ}$ より留出温度が高く、Ta化合物が0.49 $^{\circ}$ 2あり、しかもOEtが、4.2 $^{\circ}$ 8.8 と多い。このことは、Tiにかなり多くのOEtが結合していることになる。例えば、Ti(OiPr) $_{\circ}$ 3 (OEt) $_{\circ}$ 4 で1 (OiPr) $_{\circ}$ 2 (OEt) $_{\circ}$ 2 が生成している。第2留分は純Ta(OEt) $_{\circ}$ 5 より留出温度が低く、Ti化合物が0.3

(OiPr) 4.6 (OEt) 4.2 (OiPr) 3.0 (OEt) 6.8

4/2あり、しかもOiPrが3.0/9.8と多い。 このことは、Taにかなり多くのOiPrが結合してい ることになる。例えば、Ta(OiPr)(OEt) 4 やTa(OiPr) 2 (OEt) 3 が生成している。こ れらのなかには、融点が50~100℃のものがあるは ずである。

【0032】この結果から、熱処理によりTaとTiOアルコキシ基の交換反応が起きていることが証明された。よってTa(OiPr)4とTa(OEt)5を1液にして供給加熱蒸発させると、その間に化合物の変化がおこり、CVDの制御に問題を生じることがわかる。1液での室温での長期間保存でも変化はおこると予想され、ポットライフが問題となる。また別々に供給しても、気相で混合されるので、その時に化合物の変化が起こる。いずれにしても、量産装置では好ましくない。

[0033]

【実施例2】TaTi (OEt)。を含有するTa (O Et) sの製造

9

実施例1において、Ta(OEt)sとTi(OEt) 4 の仕込み比を代えた他は実施例1と同様な操作をおこ なった。仕込みはTa(OEt) 5 50. 6g(125 mmol) & Ti (OEt) 4 0. 88g (3. 9mm o1)で、Ta/Tiモル比は0.97/0.03であ った。100℃で2時間加熱後、蒸留圧力0.5~0. 4 Torr、留出温度 1 3 5~1 4 0 ℃で全量を蒸留回 10 収した。液は無色透明で、その融点は18℃であった。 [0034]

【実施例3】CVDによるTiOz含有TazOs膜の 成膜

実施例2で製造した液体を液体マスフローコントローラ ーにより0.2ml/minを送り、180℃の気化器 で送り気化させ、予熱したArガス800sccmと〇 z ガス200sccmと混ぜ、CVD室に導入した。反 応圧力2Torr、600℃の加熱されたPt/siO 2 基板上に導き、熱分解堆積させ、膜厚100 n mの膜 20 を示す図である。 を作った。XRD分析の結果、この膜はアモルファス状 であった。この膜を溶解しICP発光分光分析した結 果、原子比Ti/Ta=0.03/0.97で原料液の 比率と同じであった。成膜操作を繰り返して得られる膜 の組成は一定であった。

[0035]

【実施例4】CVDによるTiO2/Ta2Os 膜の成

10

実施例3において原料を実施例1で得られた第3留分に 代えた他は、実施例3と同様な操作を行った。XRD分 析の結果、この膜はアモルファス状であった。この膜を 溶解しICP発光分光分析した結果、原子比Ti/Ta = 0. 48/0. 52で原料液の比率とほぼ同じであっ た。成膜操作を繰り返して得られる膜の組成は一定であ った。

[0036]

【発明の効果】新規化合物のTaTi(OEt)。は液 体であり、一成分として蒸発し、これを液体マスフロー コントローラーで供給してCVDを行うと、TiOz含 有のTa2Os膜が組成変動することなく再現性よく、 容易に形成できる。一液なので量産に好適である。

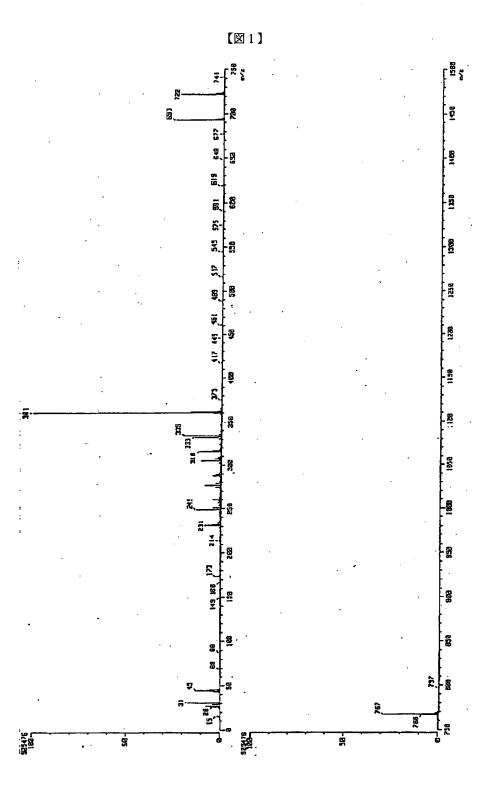
【図面の簡単な説明】

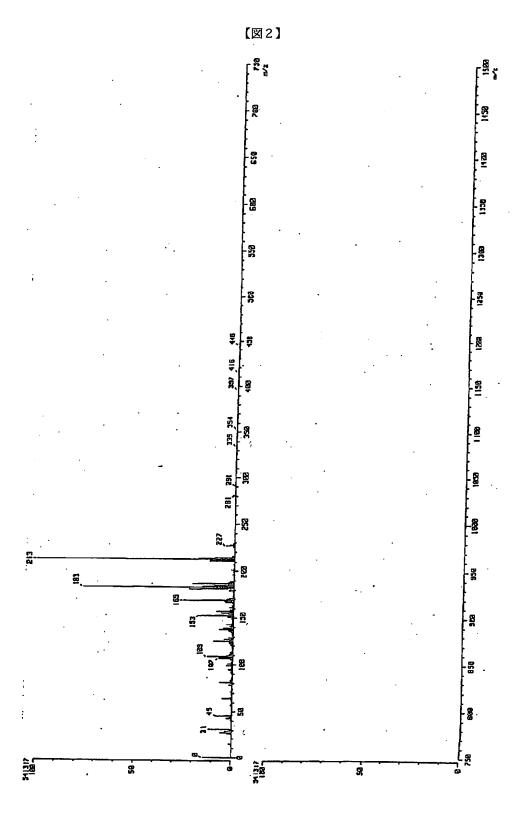
【図1】Ta(OEt)5のEI-MSによる測定結果 を示す図である。

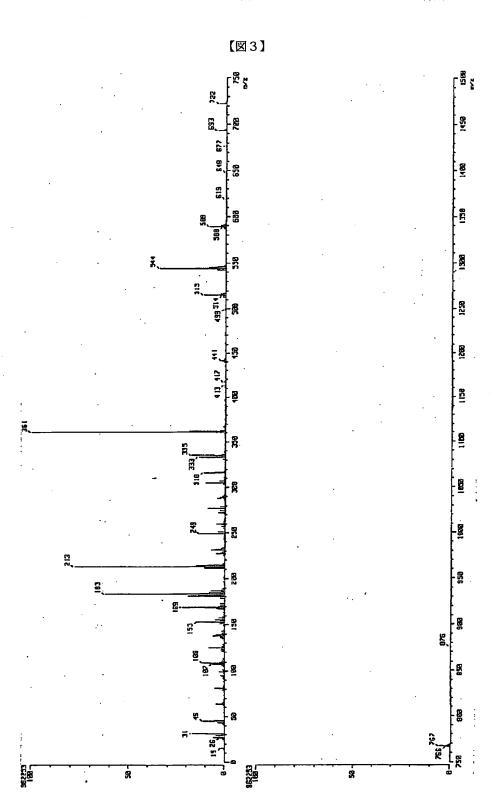
【図2】Ti(OEt) 4 のEI-MSによる測定結果

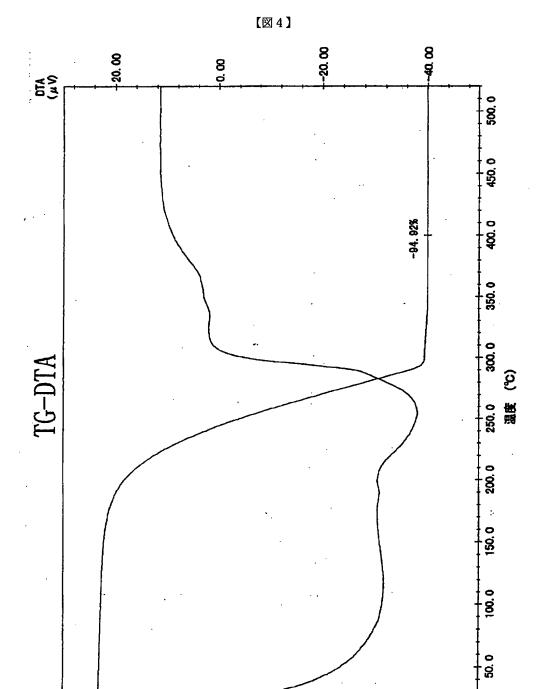
【図3】第2留分(本発明のTaTi(OEt)。が主 成分である)のEI-MSによる測定結果を示す図であ

【図4】第2留分(本発明のTaTi (OEt)。が主 成分である)のTG-DTAによる測定結果を示す図で ある。









9.8

-20.00

-40.00

-90.00

-80.00

フロントページの続き

F ターム(参考) 4H006 AA01 AA02 AB78 AB91 AC42

AD11 BC10

4H049 VN05 VP01 VQ21 VR41 VR42

VR43 VS21 VU24 VW02 VW05

4H050 AA01 AA03 AB78 AB91 AB99

AD11 WB13 WB21

4K030 AA11 BA17 BA42 BA46 BB05

CA06 CA12 FA10 JA05 KA39

LA15

5F058 BA11 BC03 BF04 BF27